

APD 集成式老化系统

PSS APDBI13002



产品简介

PRODUCT INTRODUCTION

APD 集成式老化系统用于光通信行业的 APD、APD-TIA 、 PIN、 PIN-TIA 等 TO 器件可靠性评估和老化筛选,最多支持 3072pcs 的单个老化。该系统可以提供 2mA 的恒流、5V 的恒压以及 175°C 高温老化条件,同时对器件的 VBR、TIA 电流进行实时监控,并自动进行产品失效判断。实时储存监控数据,支持对老化失效器件追溯,能够有效的提升 TO 生产的效率和可靠性,可以极大的提高器件测试的产量和质量。

产品应用

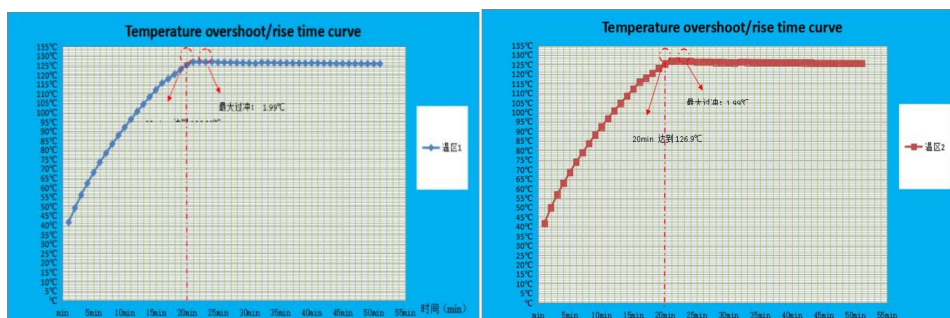
PRODUCT APPLICATION

- 批量生产环节中 APD、APD-TIA 、 PIN、PIN-TIA TO 器件进行老化筛选
- 长时间可靠性失效测试分析

产品特点

PRODUCT FEATURES

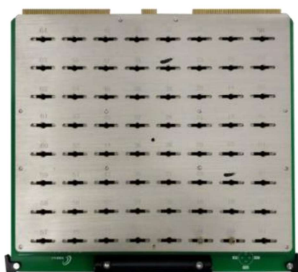
- 提供每路完全独立的驱动电流
- 两个独立老化箱体，可以完全独立控制，升温速度效率高，无过冲



- APD 电路具有限压保护功能，防止恒流开路高电压输出损坏器件
- 可靠的 EOS 防护，上电时序先 TIA 上电，再 APD 上电，下电时序先 APD 下电，再 TIA 下电，先后延时可配置，保证器件上下电安全



- 64 路老样板作为通用载体，可以实现盘测、老化、分拣不同工位直接的转料，提高生产效率



技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

参数	指标
测试路数	单板 64 路，左右 2 个仓，每层 24 个，共 3072 路
独立温区数	2 个
APD 恒流驱动	0~2mA
APD 电压测量	0~70V
TIA 恒压驱动	0~5V
TIA 电流测量	0~60mA
VPD 输出电压	0~20V
PD 电流检测	0~200uA
温度范围	RT+20°C~150°C，可定制支持 175°C。
温度精度	±2°C
温度均匀性	满载时≤3°C，空载时≤2°C
升温过冲	≤3°C
长期温度稳定性	0.5°C
升温速度	100°C/半小时
设备尺寸（宽 x 高 x 深）	1400 x 1800 x 1200 (mm)
电源规格	三相五线 AC 380V/50HZ